

有機EL部材の元素マッピング(面分析)

概要
 有機-無機複合デバイスにおけるナノ領域でのEDS元素マッピング分析(面分析)が可能。
 装置：FE-TEM(電界放出型透過電子顕微鏡)

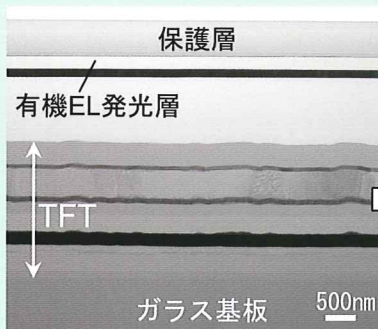


図1 有機ELの断面TEM像

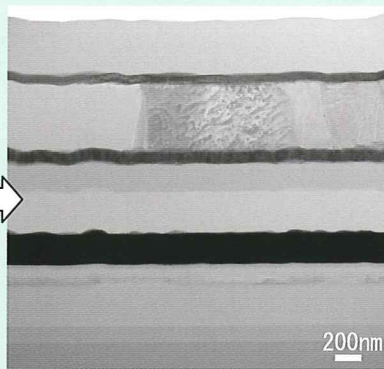


図2 TFTの断面TEM像

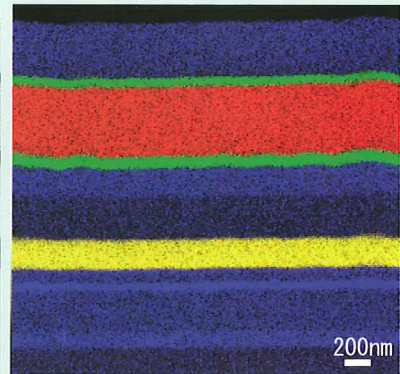


図3 EDS元素マッピング

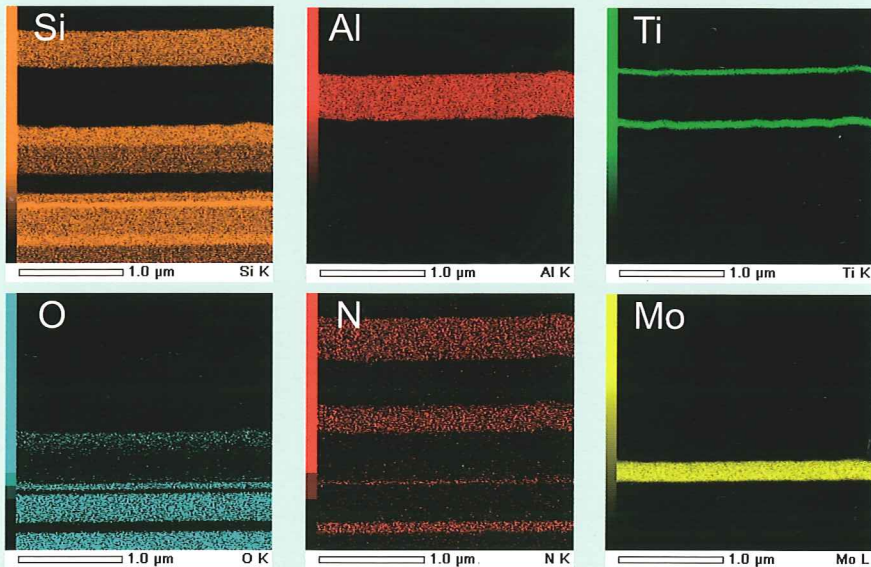


図4 EDS元素マッピング(面分析)

株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

営業部 ☎ 03-5524-3851